**Тюриков Александр Валерьевич. Электрофизические основы контроля изображений наноструктуры поверхности в сканирующем туннельном микроскопе для изучения кластерных материалов : Дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.11.14, 05.11.13 : Ижевск, 2004 174 c. РГБ ОД, 61:05-1/439**